

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Record Nr. | UNINA990003216340403321 |
| Titolo | Tempo di lavoro e occupazione : il caso italiano / Giorgio Bodo ... [et al.] ; a cura di Vittorio Valli |
| Pubbl/distr/stampa | Roma : NIS, 1988 |
| Descrizione fisica | 199 p. ; 22 cm |
| Collana | Società, economia oggi ; 5 |
| Locazione | SE |
| Collocazione | S
G/2.50 VAL |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
-
- | | |
|-------------------------|---|
| 2. Record Nr. | UNISA990000801960203316 |
| Autore | Fochi, Gianni |
| Titolo | Il segreto della chimica / Gianni Fochi |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : Longanesi & C., copyr. 1999 |
| ISBN | 88-304-1672-X |
| Descrizione fisica | 297 p. : ill. ; 20 cm |
| Collana | La lente di Galileo ; 16 |
| Disciplina | 540 |
| Collocazione | 540 FOC |
| Lingua di pubblicazione | Italiano |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |

3. Record Nr.	UNINA9910171875103321
Titolo	2016 IEEE 8th International Conference on Intelligent Systems (IS) // Institute of Electrical and Electronics Engineers
Pubbl/distr/stampa	Piscataway, New Jersey : , : IEEE, , 2016
ISBN	1-5090-1354-7
Descrizione fisica	1 online resource
Disciplina	006.3
Soggetti	Soft computing
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Sommario/riassunto	Annotation Building upon the success of IS 02, IS 04, IS 08, IS 12 (held in Sofia and Varna, Bulgaria), IS 06, IS 10 (held in London, UK), and IS 14 (held in Warsaw, Poland) the 8th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS 16 shall continue the tradition of bringing together top specialists in the broad area of intelligent systems. This forum is an opportunity for scientists from all over the world to share ideas and achievements in the theory and practice of intelligent control, artificial intelligence, decision support systems, neural networks, soft computing, data mining and knowledge discovery, ontologies, machine learning, intelligent measurement, etc.